

XJM200 Mikroskop w układzie odwróconym do badań w polu jasnym i ciemnym

Mikroskop zapewni dokładne pomiary wielkość ziarna wtrącenia metaliczne i niemetaliczne oraz pomiary: długość, szerokość, pola powierzchni itp. dodatkowo pozwoli na zliczanie obiektów, obliczenie udziału ilościowego i procentowego, grubości warstwy i stworzy dokumentację w postaci raportu. Zapewni również badanie kształtu i klasyfikację, rozmiaru grafitu, guzkowatość, grafit, ferrytowe, frakcje perlitu i inne podstawowe statystyki analizy żelaza. osiada możliwość dostosowania funkcjonalności, zawiera maski obrazu. Klasyfikacja ograniczenia rozmiaru i kształtu guzek oraz wielkość ziarna, liczba ziaren i inne statystyki podstawowe wielkości ziarna.

Oprogramowanie Materialowe

Oprogramowanie mikroskopu zapewni pomiary zgodne z międzynarodowymi normami:

Wielkość ziarna :

ASTM E-112, E-930, E-1181, ISO 643-03, JIS G 0551-05 BS 490 DIN 643-03, IS-4748-88, SIS 111101 GOST 5639-82;

Wtrącenia graphite:

ASTM A247, ISO 9451-1, DIN EN 945-94, BIS 7754 JIS G5504, IS-7754;

Pomiar zagłębienia:

ASTM ISO 2639-02, BS-6479-84, IS-6416-88 JIS G0557 DIN 50790;

Porowatość: ASTM 247;

Wtrącenia metaliczne i niemetaliczne: ASTM E-1245 E ASTM E45-97, ISO 4163-82, DIN 50602;

Guzkowatość: ASTM A 247-67, ISO-9451-1, IS-7754 DIN E 945-94, JIS G5504, BIS 7754 JIS G5504;

Odwęglenie: ASTM E1077, ISO 3887, JIS-0557-98 BS-6617-1, IS-7754 DIN 50192.

opis	Specyfikacja
System optyczny	System optyczny korygowany do nieskończoności (Infinite Plan) F=200mm
Nasadka okularowa	nasadka trinokularowa o kącie pochylenia 45°, rozstaw okularów 53~75mm, 45°, regulacja dioptryjna.
Okular	WF10X/22mm,
Karetka	Pięciopozycyjna w systemie odwróconym
Obiektywy	PLANachromat 5X/0.10 WD=26.12mm
	PLANachromat 10X/0.10 WD=20.20mm
	PLANachromat 20X/0.25 WD=8.80mm
	PLANachromat 50X/0.40 WD=3.68mm
	PLANachromat 100X/0.85(Dry) WD=0.40mm
	Long working distance Plan Achromatic BD80X/0.80 WD=0.80mm
	Long working distance Plan Achromatic BD100X/0.85 WD=0.22mm
Stolik	242×200mm, ustawiany manualnie, zakres ruchu: 30×30mm
Oświetlanie	6V 30W lampa halogenowa
	12V 50W lampa halogenowa
Filtr	Niebieski (Φ26)
	Zielony (Φ26)
	Żółty (Φ26)
Urządzenie polaryzacyjne	Prosty polaryzator i analizator
C-Mount	1X
	0.5X
Kamera cyfrowa	CMOS-5mln pixl (USB) - opcja

Material PLUS

Oprogramowanie do analizy materiałowej

Pomiary wielkości stereologicznych

Możliwość określania udziałów procentowych faz

Wbudowane dwie bazy danych dla norm amerykańskich i europejskich

Możliwość łatwego tworzenia baz własnych

Ocena wielkości ziarna

Zgodność z normami ASTM i ISO

Kamera cyfrowa CMOS-5mln pixl (USB) wraz z adaptorem 0,5x umożliwiającym odwzorowanie obrazu rzeczywistego na ekranie komputera

